

# 전자현미경 & X선 성분분석기 27

## Scanning Electron Microscope & Energy Dispersive X-ray Spectrometer

장비관리번호	F19990003
취득일자	1999-01-30
제조회사	JEOL, OXFORD(일본, 영국)
모델명	JEOL 5600(SEM) 제품번호 : MP-17410001 OXFORD 6587(EDS) 제품번호 : 37487-1390-289
설치형태	고정설치



장비용도	Electron beam을 시료표면의 관찰영역에 주사하여 시료표면의 X-ray를 검출, 에너지를 분석하여 시료의 형상을 관찰하고, 정성 정량 분석하는 장비
시험항목	시료표면 형상 분석, 성분 분석, 석면 분석
주요사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scanning Electron Microscope Main body : resolution 3.5nm User interface operation system Auto functions</li> <li>• Energy Dispersive X-ray Spectrometer Microanalytical processor ESD detector electronics Microscope interface kit Digital imaging system</li> <li>• 30만배 확대 가능</li> <li>• X-ray를 이용한 다성분 동시 정량</li> <li>• Point 분석 기능</li> </ul>
구성품	전자현미경 1대, X선 성분분석기 1대, Coater 2대
담당자	박덕신 031-460-5367